

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

60-232652

(43)Date of publication of application: 19.11.1985

(51)Int.CI.

H01J 37/08 H01J 27/16

(21)Application number: 59-087700

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

02.05.1984

(72)Inventor: TOKIKUCHI KATSUMI

KOIKE HIDEMI

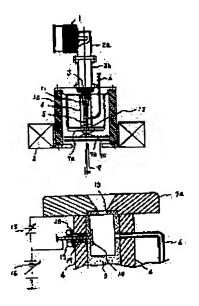
SAKUMICHI KUNIYUKI

OKADA OSAMI

(54) MICROWAVE ION SOURCE

(57)Abstract:

PURPOSE: To produce an ion source where deposition will not occur at the beam opening when producing a beam stably for long term by arranging an electrically insulated another metal material in a discharge box constructed with insulator then applying voltage between said metal material and a take-out electrode. CONSTITUTION: A microwave ion source is constructed with rectangular waveguides 2a, 2b, a ridge electrode (metal), a discharge box 5 made of boron nitride (insulator) and ion beam take-out electrode systems 7a, 7b, 7c where a metal plate 14 is fixed in said box 5. While an axial magnetic field is produced through excitation of a coil 8 and applied to said box 5 thus to lead a specimen gas through a lead pipe 6. When employing an inert gas having high mass number such as BF3 as the specimen gas while employing an electrode 15 between the metal plate 14 and the take-out electrode 7a and applying proper voltage for causing spatter, ions in the plasma will hit a slit 13 to function sputtering effectively thus to take out a stable ion beam 9 without producing deposition.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision

®日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

[®] 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60 − 232652

(6) Int.Cl.⁴ H 01 J 37/08 27/16 識別記号 庁内整理番号

❷公開 昭和60年(1985)11月19日

7129-5C 7129-5C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全 4 頁)

❷発明の名称 マイクロ波イオン源

②特 願 昭59-87700

❷出 願 昭59(1984)5月2日

@発 明 者 登木口 克巳 国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中 央研究所内 @発 明 英 已 国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中 者 小 池 央研究所内 砂発 明 国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中 者 作 道 訓 之 央研究所内 明 ⑫発 出 国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中 老 Æ 悠 身 央研究所内 株式会社日立製作所 ⑪出 願 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

⑩代 理 人 弁理士 高橋 明夫 外1名

明 粗, 杏

発明の名称 マイクロ波イオン源

特許請求の範囲

- 2. 特許請求の範囲第1項記載の発明において、 放電箱内にマイクロ波電界を発生させるリッジ 電極に接した放電箱側面の一部あるいは全部を、 くりぬき、プラズマとリッジ電極が互いに接触 するように構成せしめ、かつこのリッジ電極を 電気的に絶縁し、以つて第1項記載の電気的に

絶縁された金属材料がリッジ電極であるように 構成したマイクロ波イオン滅。

- 3、特許請求範囲第1項記載のマイクロ被イオン 源において、放電箱内に設ける別の金属材料が 化学的に安定な白金であることを特徴としたマ イクロ波イオン源。
- 4. 特許請求の範囲第1項記載のマイクロ波イオン源において、放電箱に導入する試料ガスの他に、質量数の高い不活性気体も微量、導入せしめ、以つてスパツタ作用による折出物防止を効率良く行わしめたことを特徴とするマイクロ波イオン源。

発明の詳細な説明

〔発明の利用分野〕

本発明はマイクロ被イオン源に係り、特にその 長寿命、安定動作のための改良に関する。

〔発明の背景〕

第 1 図は従来のマイクロ波イオン源の構造を説明する図である。マイクロ波イオン源は、マイクロ波(2 . 4 5 G H z)が伝播する連波管である

矩形 夢 被 管 2 a 。 2 b , 放電部においてリッジ 導 波 管 遊を形成するリッジ 電極(金属製) 4 。 リッジ 電極間に設けられたボロンナイトライド (絶 縁物)製の放電箱 5 ,及びイオンビーム 9 を 引出すための引出し電極系 7 a , 7 b , 7 c で 構成される。 さらに放電箱 5 には、コイル 8 の 励磁で発生する 軸方向磁場 が印加され、 試料ガスが導入パイプ 6 を 通し導入される。

しかし第1図に示した従来のマイクロ液イオン 悪を使つて半導体用イオン打込みで必要なイオン 種である B^T ビームを得るため、BF3 ガスない はBC 2 3 ガスを導入すると次の様な問題点があった。 た。即ち、イオンビーム引出し頭の部(第1図が はののついに折出物が堆積し、引出してが ななつてピーム電流が減少する。また、引出して を重圧が印加された電極 7 b との間に 異常が 発生しやすくなり、イオン源の安定動作が困難と なった。これは、関するため、 離するため、はく離物質が電極 7 b をたたき、そ の結果、発生する二次電子が異常放電の火種にな るためと考えられる。

以上の様な出口関口部における折出物堆積の防 止を試みた従来例を第2因に示す。第2因では、 引出し電極?aにさらに導電性スリツト13を設 けて、イオンビーム引出し関ロ部を分割構造とし てある。この構造の採用により、スリント13は 熱的に絶縁されるから、放電箱5内に発生するプ ラズマ照射で効率良く加熱される。この従来例に よれば、スリツト13は600~800℃に加熱 される。この時BF3ガスを導入すると、析出物 (一般には放電箱構造材のボロンナイトライドで ある)は、熱解離、蒸発。あるいはフツ素原子と 高温化学反応をおこし、除去される。したがつて、 析出量の著しい減少がみとめられた。例えば、開 口部に分割構造をほどこさない第1回の従来例で は、約4時間の動作後で開口部面積が約半分にな つていたものが、第2因の例では4時間の動作で の面積減少は10%以下に抑えられた。

しかし、第2回の従来例では、10時間以上の

長時間選転に対し、析出に伴うビーム電流の減少が無視できなくなる。また、スリントの温度は、イオン源の動作条件により変わるため、あらゆる動作条件に対し、析出量を低レベルに抑えることは困難であつた。

(発明の目的)

本発明の目的は、マイクロ波イオン源を使つて目的とするイオンビームを長時間、安定に得るにあたり、ビーム関口部に折出物が付着しないイオン源を提供することにある。

(発明の概要)

第2 図に述べた従来例による析出防止法は、関口部の温度上昇効果を利用した化学的な手法である。化学反応は系の温度, 圧力, ガス成分等によって複雑かつ微妙に変化するから、前述の従来例が効力を発揮しうるイオン源動作条件は狭い。一方、イオンビーム、特に質量数の高いイオンビーム、特に質量数の高いイオンビームを基板にあてると、その運動量が大きいことから、基板原子がはじき飛ばされ、いわゆるスパツタリング作用による表面洗浄が行える事がよく知

られている。この点に着目し、放電箱 5 内に発生するプラズマ中のイオンを使つてスパツタを行えば、折出物は物理的作用により除去できると考えられる。

プラズマ中のイオンにエネルギーを与え、スパッタ作用を持たせるためには、プラズマ中にはを印加した二枚の金属板を配き、負電圧のの金属板表面をスパッタ、洗浄する方法、では多いでは、プラスでは、プラスでは、カー 1 3 の間に正角の電圧がのののできる。第2 図の従来例では、この金属板を持込む工夫を行えば、この金属板を持込む工夫の電圧が印加できる。スパッタである。

(発明の実施例)

以下、本発明の一実施例を第3回により説明する。本実施例では、放電室5内に金属板14を取付けた。またこの金属板14はリンジ電極4に対し、図に示した様に絶歓码子18.19をはさむ

..

特開昭60-232652(3)

第3回の実施例において、試料ガスにBF3を使い、さらに金属板14に、化学的反応に耐性のある白金を使い実験を行つた。この時、金属板14と引出し電極(スリット13も同電位)7aとの間に印加した電圧は0.1~10kVである。14は正極に、7a(13)を負極とした。上記電圧・一般にスパッタ効率が1以上になる領域である。BF3ガスを導入して、60kVの加速電圧(電源16の印加電圧)でイオンビームを引出し、そのビームを扇形磁場形質量分離器で質量分離したところ、4mA以上のB+ビームが得られた。またスパッタ効果が有効に働いた結果、10時間以上にわたつて折出物の発生のない、安定なビーム引出しが行なえた。

なお、本実施例では、スパツタ用電源15とし

て直流を使用したが、交流電源にしても同様な効果が確かめられた。さらに、試料ガス、例えばAr(クリプトン), Xe(ゼノノル ジを混ぜできる事が確かかられた。これである。これである。なお、BF3 ガスのでも、それまでは、カルンタを行っても、それまでできる。が出来を行っても、それまでは、カルとなったが出来を行っても、それまでは、カルとなっても、というによる。なお、BF3 ガスのでも、それまでは、ガンタを行っても、それまでは、ガンタを行っても、それまでは、ガンタを行っても、それまでは、ガンタを行っても、が分り、BF3 パンタを行っても、それまでは、ガンシャである。とが明まるとなった。

第4図は本発明に基づく別の実施例を説明する 図である。図では、電気的に絶縁した金属板を放 電箱内に設けるかわりに、リッジ電極で代用させ た実施例である。図では、2ケのリッジ電極のう ち片方の電極にプラズマが接触するように、放電 箱5の一部がくり抜かれている。またリッジ電極

そのものも、他のイオン源構造物と絶縁物20を用いて電気的に絶縁されている。第4回に示した実施例で実験を行つたところ、第3回における実施例と同様な効果が得られ、安定なイオンビーム引出しが可能であつた。なお本実施例ではBC & 3 ガスを用いたB * ビーム引出しを行い、BC & 3 ガスの場合にも、本発明の効果が得られることが合わせて確かめられた。

[発明の効果]

本発明によれば、マイクロ被イオン湖の長時間 動作で発生していたイオンピーム引出し間のに おける析出物の堆積が防止でき、例えばBFF4 スを使用した場合、10時間以上におたつさるで 成と使用した場合、10時間以上に持続できを置いたできるでは、 が明らかになった。半導体イオン打込み装置時間は少くとも10時間以上必要であれての 持続時間は少くとも10時間以上必要であるで 発明により大電流B*打込みが実用レベルの な安定に長時間行えることになり、実用に供し の効果は著しく大である。

図面の簡単な説明

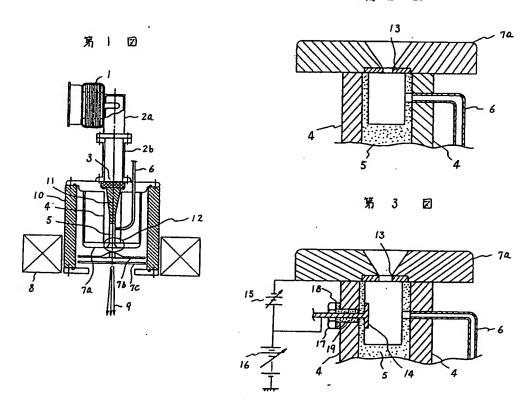
第1図,第2図は従来例のマイクロ波イオン源を示す要部群断面図、第3図,第4図は本発明に基づく実施例になるマイクロ波イオン源の要部群断面図である。

4 … リッジ電極、5 … 放電箱、6 … ガス導入パイプ、7 a … 引出し電極系、1 3 … スリット、1 4 … 金属板、1 5 … スパッタ用電源、1 6 … ピーム加速用高圧電源、1 7 … ナット、1 8 , 1 9 … 絶縁符子。

代理人 弁理士 髙橋明

特開昭60-232652(4)

第 2 团



第 4 日

